# Термическое разрушение двумерных графитовых островков на тугоплавких металлах (Ir, Re, Ni, Pt)

© Н.Р. Галль, Н.П. Лавровская, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021 Санкт-Петербург, Россия e-mail: gall@ms.ioffe.ru

#### (Поступило в Редакцию 10 июля 2003 г.)

11:12

Изучено термическое разрушение двумерных графитовых пленок (ДГП) на четырех подложках: Ni(111), Re(10-10), Ir(111), Pt(111). Показано, что во всех случаях лимитирующей стадией процесса является отрыв краевого атома углерода от островка. Оценена энергия активации этого процесса — она изменяется от 2.5 eV на никеле до 4.5 eV на иридии. Природа этих изменений связана с большей или меньшей способностью поверхности металла устанавливать сильные хемосорбционные связи с валентно активными краями графитовых островков, ослабляющих С-С связи в графите.

Двумерные графитовые пленки (ДГП) на твердых телах — интереснейший в научном плане объект, который можно отнести к двумерным кристаллам. Они образуются на многих металлах (Ir, Pt, Rh, Ni, Re, Mo, Ru) без кристаллогеометрического согласия между графитовым слоем и поверхностью металла, за исключением грани (111)Ni [1,2]. Графитовая сетка хорошо "видна" при исследовании монослоя графита на (111)Ir и (10-10) Re методом сканирующей туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии [3,4]. Аналогичные результаты получены и методами дифракции медленных электронов (ДМЭ) [5,6], SEXAFS [7] и неупругого отражения электронов [8,9]. Обладая валентным насыщением, двумерный слой графита связан с поверхностью металла лишь слабыми силами Вандер-Ваальса [1]. Этот факт позволяет ДГП сохранить все физико-химические свойства, присущие поверхности базисной грани монокристалла графита: работу выхода, химическую и каталитическую пассивность, адсорбционные свойства и др. [2].

Ранее нами были подробно изучены условия образования и роста графитовых пленок на различных тугоплавких металлах, их физико-химические свойства [2]. В данной работе рассматриваются другие важнейшие вопросы, характеризующие физико-химические свойства ДГП — механизмы, а также кинетика и энергетика термического разрушения двумерных островков графита на четырех металлах (111)Pt, (10–10)Re, (111)Ni и (111)Ir.

#### Методы и техника эксперимента

Применена масс-спектрометрическая техника, главные элементы которой приведены в [10]. Также использовался сверхвысоковакуумный призменный электронный оже-спектрометр высокого разрешения, описанный в [11], позволяющий по форме и энергетическому положению  $C_{KVV}$  оже-спектра отличить углерод, находящийся на поверхности в разных химических состояниях, например, в форме адсорбированного углеродного "газа", поверхностного карбида, графита, алмаза или фуллерита [12]. Форма оже-спектра от графитовых островков повторяет форму оже-спектра от базисной плоскости монокристалла графита. В качестве образцов использовались тонкие текстурированные металлические ленты размером  $1 \times 0.02 \times 40$  mm, которые прогревались прямым пропусканием переменного тока и очищались от возможных примесей высокотемпературным последовательным прогревом в атмосфере кислорода и в условиях сверхвысокого вакуума по методике, описанной в [2]. Текстура лент была выражена гранью (111) в случае Ni, Ir и Pt и гранью (10-10) для Re. Поверхности лент были однородны по работе выхода. Температура лент измерялась микропирометром, а в непирометрической области — линейной экстраполяцией зависимости температуры от тока накала. Температурная неоднородность образцов в пирометрической области не превышала  $\Delta T = 5 \,\mathrm{K}.$ 

Существует несколько способов получения графитовой пленки на металлах. Один из них — напыление потоком атомов углерода на подогретую поверхность металла из специального, разработанного нами абсолютно калиброванного источника [13]. Другой способ — крекинг молекул углеводородов (чаще всего это бензол  $C_6H_6$ ) на нагретом металле, при этом молекула разлагается на атомы, водород десорбируется, а на поверхности остается углерод. И тот и другой способы приводят к росту на поверхности островков графита и требуют знания температурной области  $\Delta T$  их образования [2]. Сливаясь, островки графита образуют сплошную графитовую пленку.

Образующиеся островки графита двумерные. Подробное доказательство их двумерности можно найти в наших обзорах [1,2]. Отметим, что использование напуска бензола приводит к образованию однородного монослоя графита автоматически, так как на пассивной поверхности графита молекулы бензола не диссоциируют и роста пленки сверх одного слоя не происходит [1]. Образование ДГП, их сплошность и толщину охарактеризовывали с помощью оже-электронной спектроскопии высокого разрешения [11].

В данной работе относительную площадь островков графита  $\Delta S/S$  определяли простым и хорошо отработанным способом — зондированием поверхности малым по плотности потоком молекул CsCl. Данный метод детально описан в [1]. Суть его в том, что на валентнопассивных островках графита практически не происходит диссоциация CsCl. В то же время на участках поверхности, не занятых островками графита, а это может быть чистый металл, металл с хемосорбированным углеродным "газом", участки поверхности с карбидом металла, диссоциация молекул при T > 800 К идет со 100%-ной вероятностью CsCl  $\rightarrow$  Cs + Cl. При T > 800 K один из продуктов реакции диссоциации — цезий десорбируется с поверхности в виде иона Cs<sup>+</sup>, образованного путем поверхностной ионизации [14]. Для всех использованных в данной работе металлов и пленочных систем потенциал ионизации цезия ( $V_{Cs} = 3.89 \, \text{eV}$ ) был всегда меньше работы выхода участков, свободных от островков графита, т. е. имела место 100%-ная десорбция цезия в виде иона Cs<sup>+</sup> [14]. Поэтому, измеряя ток ионов цезия  $I^+$ , получали информацию об относительной доле поверхности, свободной от графитовых островков  $I^+ = ev \cdot (S_{\text{tot}} - S)$ , где v — плотность потока молекул CsCl, поступающих на поверхность; S — площадь, занятая островками; S<sub>tot</sub> — полная площадь образца. Если в начале опытов измерить ток ионов цезия  $I_0^+$  с чистой поверхности металла  $(I_0^+ = e\nu \cdot S_{tot})$ , то

$$rac{I^+}{I_0^+} = rac{S_{
m tot} - S}{S_{
m tot}} = 1 - rac{S}{S_{
m tot}}$$
или  $S/S_{
m tot} = 1 - rac{I^+}{I_0^+},$ 

т.е. относительная доля поверхности, занятая островками графита, сводится к простому измерению двух токов ионов цезия:  $I_0^+$  и  $I^+ = f(S)$ . Очевидно, что измеренный в любой момент времени ток  $I^+$  будет нести информацию о доле площади, занятой графитовыми островками. В работе использовались малые по плотности потоки молекул CsCl:  $v_{CsCl} = 1 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ . Имелась возможность быстро перекрывать поток молекул к поверхности образца. Таким образом, зависимость  $I^+ = f(t)$ отражает кинетику роста или разрушения графитовых островков.

### Результаты

Образовав на поверхности металла графитовые островки при температуре T, можно ожидать, что найдется такая более высокая температура  $T_d > T$ , при которой островки начнут разрушаться. Опыты показали, что для всех четырех исследованных металлов температурная область разрушения графитовых островков  $\Delta T_d$  значительно ниже, чем температура механического разрушения подложки и температура начала заметной десорбции  $T_{des}$  атомов углерода с поверхности тугоплавких металлов (обычно  $T_{des} \ge 2000 \text{ K}$ ). На платине, никеле и рении разрушение графитовых островков приводит к уменьшению общего количества углерода на поверхности. Видимо, это связано с растворением оторвавшихся

от края графитового островка атомов углерода в объеме металла. Исключение составляет лишь иридий, в котором углерод при  $T \le 2000$  К практически не растворяется и углеродный материал при разрушении островков остается на поверхности в фазе хемосорбированного углеродного "газа" [10].

Мы предполагаем, что элементарным актом разрушения графитового островка является отрыв одиночного атома углерода от края графитового островка и переход его в хемосорбированное состояние на поверхности металла. Заменим реальную картину упрощенной и будем считать, что графитовые островки имеют форму дисков одинаковой площади  $S_1$ . Тогда количество  $n_1$ атомов углерода в отдельном островке при подъеме температуры до некоторой  $T > T_d$  будет уменьшаться со временем по закону

$$-\frac{dn_1(t)}{dt} = n_b(t)^* W = n_b(t) C \exp[-E_{\text{sep}}/kT], \quad (1)$$

где  $n_b(t)$  — число атомов углерода в граничном слое островка в момент t; W — вероятность двумерной сублимации; C — предэкспоненциальный множитель;  $E_{sep}$  — энергия активации двумерной сублимации, или, иначе говоря, энергия, требуемая для отрыва краевого атома углерода от островка.

Для простоты будем также считать, что упаковка атомов углерода в островках такая же, как и в базисной плоскости графита и не зависит от размера островка; тогда  $S_1 \approx a^*n_1$ , где a — площадь, приходящаяся на один атом углерода. Считая  $n_b = 2\pi r/d$ , где r — радиус углеродного островка-диска, d — эффективный диаметр атома углерода в графитовой сетке,  $d = \sqrt{4a/\pi}$ , и учитывая, что

$$r = \sqrt{\frac{n_1 a}{\pi}} = \sqrt{\frac{aN}{\pi m}},$$

где N — полное количество атомов углерода во всех островках на  $1 \text{ cm}^2$ , m — концентрация островков, находим

$$n_b = \frac{\pi}{\sqrt{m}} \sqrt{N(t)}.$$

Тогда из (1) находим

$$\frac{dN}{\sqrt{N}} = -\pi\sqrt{m}C\exp[-E_{\rm sep}/kT]dt.$$
 (2)

Решение уравнения (2) для произвольного t с учетом начального условия  $N = N_0$  при t = 0 имеет вид

$$1 - \sqrt{\frac{N}{N_0}} = -\frac{\pi\sqrt{m}C\exp\left[-\frac{E_{\rm sep}}{kT}\right]}{2\sqrt{N_0}} \cdot t.$$
(3)

Отношение  $N(t)/N_0 = S(t)/S_0$ , где  $S_0$  — площадь, занятая островками при t = 0, определяется экспериментально методом диссоциации молекул CsCl, описанным выше. Имея набор кривых  $(1 - \sqrt{S(t)/S_0}) = f(t)$ , из зависимости  $\ln t = f(1/kT)$  при каждом значении



**Рис. 1.** Уменьшение относительной площади, занимаемой графитовыми островками на (10-10) Re при изотермическом отжиге при различных температурах *T*, K: *I* — 1280, *2* — 1240, *3* — 1215. Начальное состояние во всех случаях *S*/*S*<sub>tot</sub> = 0.3.

S = const находили энергию отрыва атома углерода от графитового островка. Зная  $E_{sep}$ , из уравнения (3) можно найти и величину  $\sqrt{mC}$ .

В качестве примера рассмотрим процесс разрушения графитовых островков на грани (10-10) рения. Чистый рениевый образец кратковременно  $(t \sim 10-30 \, \mathrm{s})$ выдерживали в парах бензола ( $P_{C_6H_6} \sim 1 \cdot 10^{-7}$  Torr) при T = 1050 К. При этом на поверхности быстро образовывались островки графита, в то время как объем металла оставался практически свободным от углерода. Опыты показали, что углерод при данной температуре находится на поверхности только в графитовых островках, поскольку отдельные атомы углерода быстро растворяются в объеме металла [15]. Тем не менее для чистоты эксперимента образец отжигали несколько минут после откачки бензола при T = 1050 К — островки графита при этом не разрушались, а возможное небольшое количество углерода, накопившееся в приповерхностной области, разгонялось по всему объему металла, тем самым мы уменьшали вероятность обратного потока углерода из объема на поверхность. Затем температуру рения поднимали до  $T_d \ge 1200 \,\mathrm{K}$  и снимали кинетику разрушения островков, т.е. определяли зависимость  $S/S_0 = f(t)$ . При этом островки разрушались полностью (рис. 1). Отметим, что кривые разрушения хорошо воспроизводились от опыта к опыту, несмотря на то что объем образца не очищался от накопленного там углерода. Это говорит о том, что при данных температурах  $\Delta T$  концентрация углерода в объеме рения далека от предельной растворимости, углерод быстро диффундирует по решетке металла и обратным потоком углерода из объема на поврехность можно пренебречь.

Обработка результата производилась следующим образом. Используя кривые на рис. 1, строились графики зависимостей  $\ln t = f(1/kT)$  для разных S = const, откуда была определена энергия отрыва атома углерода от островка  $E_{\text{sep}} = (3.0 \pm 0.2)$  eV. Отметим, что в опытах

 $S/S_{\text{tot}}$  варьировалась в пределах 0.2–0.6, а  $S/S_{\text{tot}} = 1$  соответствует монослою графита с  $N_c = 3.86 \cdot 10^{15} \,\text{cm}^{-2}$ . Затем строилась зависимость

 $S(t)/S_0 = (1 - Bt)^2$ ,

где

$$B = \frac{\pi \sqrt{m} C \exp[-E_{\rm sep}/kT]}{2\sqrt{N_0}}.$$
 (4)

107

Величину *В* подбирали таким образом, чтобы расчетные зависимости  $S/S_0 = f(t)$  соответствовали бы полученным экспериментально (рис. 1, пунктир). Зная *B*, по формуле (4) определили произведение предэкспоненциального множителя на корень из числа островков  $\sqrt{m} C = 3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ . В наших работах по изучению топографии монослоя графита на (10-10)Re методом сканирующей туннельной микроскопии можно оценить концентрацию графитовых островков при покрытиях, близких к монослойным, которая составила  $m \sim 10^{12} \text{ cm}^{-2}$  [3,4]. Зная *m*, можно оценить и  $C \sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$ .

Аналогичным образом мы изучили разрушение графитовых островков на (111)Ni и (111)Pt. Отличие состояло в температурном интервале разрушения островков  $\Delta T_d$ . Результаты опытов представлены в таблице. Полученные величины  $\sqrt{mC}$  имели тот же порядок величины, что и в случае рениевого образца.

На иридии графитовые островки начинают разрушаться при  $T_d \ge 1600 \, \text{K}$ , что говорит о существенно более сильной энергии связи краевого атома углерода с островком по отношению к выше рассмотренным подложкам. Так как оторвавшиеся от островка атомы углерода не растворяются в объеме иридия и не десорбируются, то общая концентрация углерода на поверхности не изменяется и по мере уменьшения площади графитовых островков при их термическом разрушении растет концентрация атомов углерода в фазе хемосорбированного углеродного "газа". Это в свою очередь ведет к увеличению потока атомов углерода переходящих из фазы хемосорбированного "газа" в графитовые островки. Поэтому конечным результатом разрушения для данной  $T_d = \text{const}$  является установление динамического равновесия, когда поток двумерной сублимации сравнивается с потоком углерода на островки из хемосорбированной "газовой" фазы. При этом площадь островков перестает изменяться (рис. 2) и стабилизируется на некотором, зависящем от Т уровне. Если уменьшить

Энергии активации отрыва краевого атома от графитового островка  $E_{sep}$  и температурные интервалы  $\Delta T_d$  разрушения графитовых островков на различных подложках

| Me       | $E_{\rm sep}, {\rm eV}$ | $\Delta T_d, \mathbf{K}$ |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| (111)Ni  | 2.5                     | 950-1050                 |
| (1010)Re | 3.0                     | 1200-1300                |
| (111)Pt  | 3.2                     | 1300-1400                |
| (111)Ir  | 4.5                     | 1650-1850                |



**Рис. 2.** Уменьшение относительной площади, занимаемой графитовыми островками на (111) Iг при изотермическом отжиге при различных температурах T, K: I - 1940, 2 - 1840, 3 - 1715. Начальное состояние во всех случаях  $S/S_{tot} = 0.5$ 

температуру до T < 1600 К, то площадь островков восстановится до прежних размеров  $S = S_0$  — весь углеродный "газ" снова перейдет в графитовые островки. Чтобы пренебречь обратным потоком углерода из фазы хемосорбированного "газа", обрабатывались только самые начальные участки зависимостей  $S/S_0 = f(t)$ . Результаты опытов также представлены в таблице.

## Обсуждение

Из данных таблицы видно, что в отличие от объемного графита, для которого отрыв краевого атома углерода в слое  $\sim 6 \, \text{eV} \, (T_d > 2300 \, \text{K}) \, [1]$ , в случае графитовых островков, адсорбированных на металлических поверхностях, энергия отрыва может быть значительно меньше. Разумно предположить, что валентно-активные края графитовых островков образуют сильную хемосорбционную связь с атомами металлической подложки, что ослабляет С-С связи краевого атома углерода с соседями и в свою очередь сильно уменьшает температуру разрушения графитовых островков на металле (см. таблицу; рис. 3, а). Эксперимент показывает, что легче всего разрушить графитовые островки на поверхности никеля: это хорошо коррелирует с тем фактом, что из всех изученных подложек никель — единственный карбидообразующий металл. Наиболее термостойкими оказались графитовые островки на иридии, иридий не образует карбидов, практически не растворяет углерод в своем объеме и, видимо, в наименьшей степени способен к образованию химических связей С-Ме. Интересно отметить, что если, например, на (111)Ir образовать пленку графита толщиной в несколько атомных слоев путем напыления атомарным потоком при  $T \approx 1700 \,\mathrm{K}$  [2] (рис. 3, b), то температура разрушения графитового слоя и соответственно удаления углерода с поверхности увеличивается до  $T_d > 2300$  K, что соответствует  $E_{sep} \sim 6 \text{ eV}$  — величине, характеризующей термическое разрушение объемного графита. В самом деле, в этом случае исключается контакт краевого атома верхнего графитового слоя с металлом и, следовательно, нет оснований ожидать, что действие хемосорбционных связей C—Ме уменьшит энергию активации отрыва краевого атома от островка графита.

## Краткое содержание и выводы

В работе предложен механизм разрушения графитовых островков на металле и определена энергия связи краевых атомов углерода с графитовым островком, ответственная за процесс их термического разрушения на разных подложках — Ni(111), Re(10-10), Ir(111), Pt(111). Наиболее термостабильными оказались графитовые островки на некарбидообразующем иридии энергия связи краевого атома углерода с островком в этом случае достигает величины  $4.5 \,\mathrm{eV}~(T_d > 1600 \,\mathrm{K}).$ Показаны уникальные возможности нетрадиционного метода анализа поверхности, содержащей графитовые островки — метод диссоциации молекул CsCl. Этот простой метод, чувствительный только к графитовой фазе поверхностного углерода, позволяет "следить" за кинетикой роста и разрушения графитовых островков при любых температурах выше 850 К, что не под силу многим традиционным методам диагностики поверхности, видимо, может быть использован и для изучения свойств других валентно-насыщенных пленок.



**Рис. 3.** Схема термического разрушения двумерных графитовых островков. a — на поверхности иридия,  $E'_{sep}$  — энергия активации отрыва контактирующего с металлом краевого атома углерода; b — на многослойной графитовой пленке или на монокристалле графита,  $E'_{sep}$  — энергия активации отрыва краевого атома от графитового слоя. I — графитовый островок, 2 — краевой атом углерода в графитовой сетке, 3 — иридиевая подложка.

Работа выполнена при поддержке Государственной программы РФ "Физика твердотельных наноструктур" (проект 8Г158).

#### Список литературы

- Tontegode A.Ya. // Progress in Surface Sciencs. 1991. Vol. 38. P. 201–376.
- [2] Gall N.R., Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya. // International Journal Modern Phys. B. 1997. Vol. 11. N 16. P. 1865–1911.
- [3] Макаренко И.В., Титков А.Н., Вакар В., Рутьков Е.В., Тонтегоде А.Я., Усуфов М.М. // ФТТ. 1998. Т. 40 (8). С. 1570–1578.
- [4] Макаренко И.В., Титков А.Н., Вакар В., Рутьков Е.В., Тонтегоде А.Я., Усуфов М.М. // Поверхность. 1999. № 7. С. 39–51.
- [5] Eizenberg M., Blakely J.M. // Surf. Sci. 1979. Vol. 82. P. 228– 237.
- [6] Zi-Pu Hu, Ogletree D.F., Van-Hove M.A., Somorjai G.A. // Surf. Sci. 1987. Vol. 180. P. 433–440.
- [7] Rossei R., De Crescenzi M., Sette F., Quaresima C., Savoia A., Perfetti P. // Phys. Rev. B. 1983. Vol. 28. P. 1161– 1167.
- [8] Aizawa T., Souda R.R., Otani S., Ishizawa Y., Oshima C. // Phys. Rev. B. 1990. Vol. 42. P. 1469–1474.
- [9] Aizawa T., Hwang Y., Hayami W., Souda R., Otani S. // Surf. Sci. 1990. Vol. 260. P. 311–328.
- [10] Kholin N.A., Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya. // Surf. Sci. 1984. Vol. 139. P. 155–168.
- [11] Агеев В.Н., Рутьков Е.В., Тонтегоде А.Я., Холин Н.А. // ФТТ. 1981. Т. 236. Вып. 8. С. 2248–2259.
- [12] Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya., Usufov M.M. // Phys. Rev. Lett. 1995. Vol. 74. P. 758–764.
- [13] Gall N.R., Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya., Kuznetsov P.B., Gall R.N. // J. Chemical Vapor Deposition. 1997. Vol. 6. N 1. P. 72–76.
- [14] Zandberg E.Ya., Ionov N.I. Surface Ionization. Israel Program for Scientific Translations. Jerusalem, 1971. 376 p.
- [15] Gall N.R., Mikhailov S.N., Rut'kov E.V., Tontegode A.Ya. // Surf. Sci. 1987. Vol. 191. P. 185–203.